

FAPG150D 全自動雙面探針台

針對功率型DIODE、MOSFET、IGBT等組件的晶圓測試

PEGASUS FAPG150D是一台雙面自動化探針結構的探針台，手臂自動取晶圓至預對準器調平及點測位置測試，全圓式夾片盤可提供穩定且快速的測試環境，針對不同應用設定最佳的點測速度與針痕，並可因客戶需求提供定制化的設計。



性能特點

- 中文Windows操作介面，操作簡易
- 可建立不同產品設定檔
- CCD Wafer自動調平及尋找起測晶粒
- 模組化電控結構，易於維修
- 高精密馬達驅動，提供安靜的運行環境
- 可同時放置2組cassette
- 預對準器校正wafer
- TTL/RS232通訊方式，可搭配各廠測試機
- 優越的點測速度與極佳的探針針痕
- 可因客戶需求進行定制化設計
- 可支援6"和4"夾片盤
- 簡易操作平臺及搖桿設計

FAPG150D 全自動雙面探針台

技術規格

X/Y軸

- 架構：高精度迴圈式滾珠螺桿
- 行程：285mm × 250mm
- 解析度：0.5 μm
- 精度： $\leq \pm 4 \mu\text{m} / 203\text{mm}$
- 重複性： $\leq \pm 4 \mu\text{m} / 203\text{mm}$

夾臂

- 行程：20mm
- 解析度：1 μm
- 精度： $\leq \pm 2 \mu\text{m}$
- 重複性： $\leq \pm 4 \mu\text{m}$

夾片盤

- 材質：聚醚醚酮 Peek
- 夾片尺寸：可支援6"or 4"

平台

- 打墨器：1組
- 抗干擾鉛殼接線盒：1組

測試時間

Test Time (ms)	Index Step(μm)				
	300	500	1000	2000	
Chuck Lift (μm)	300	42	47	56	70
	500	52	57	66	80
	800	62	67	76	90
	1000	68	74	83	97

顯微鏡

- 數位顯微鏡
- 內建LED光源
- 倍率：X20 ~ X90

外觀尺寸

- 1020(D) × 1360(W) × 1465(H) mm
(不含螢幕，信號燈)

重量

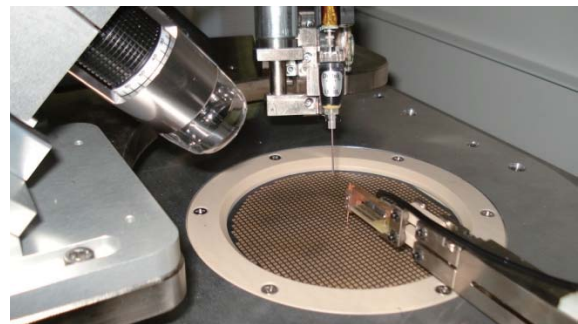
- 490Kg(不含測試機)

真空

- 4-6Kgf/cm²

氣壓

- 0.5MPa



點測平台